

## Список литературы

1. Пакулов Н. И., Уханов В. Ф., Чернышов П. Н. Мажоритарный принцип построения надежных узлов и устройств ЦВМ. М., 1974.
2. Международная классификация изобретений (четвертая редакция). М. кл.<sup>4</sup> НОЗК 19/23. М., 1985.
3. Боголюбов И. Н., Овсневич Б. Л., Розенблюм Л. Я. // Сети передачи информации и их автоматизация. М., 1965. С. 80.
4. Фон Нейман Дж. // Автоматы. М., 1956. С. 68.
5. Лысиков Б. Г. Арифметические и логические основы цифровых автоматов. Минск, 1980.

Поступила в редакцию 23.06.86.

УДК 621.382.049.77.019.3

В. М. БОРЗДОВ

### О ПОСТРОЕНИИ ОПТИМАЛЬНОЙ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

В данной статье в рамках физико-статистического подхода к оценке параметрической надежности высоконадежных изделий электронной техники [1, 2] рассматривается вопрос о возможности построения оптимального доверительного интервала для среднего времени их безотказной работы. Предполагается, что в силу высокой надежности этих изделий отсутствуют какие-либо данные о статистике отказов в нормальных условиях их эксплуатации, но известна физико-математическая модель процесса деградации, а плотность распределения времени до первого отказа  $f(t, \mu_\epsilon, \sigma_\epsilon)$  подчиняется логарифмически нормальному распределению

$$f(t, \mu_\epsilon, \sigma_\epsilon) = \frac{1}{t} \varphi_{\mu_\epsilon, \sigma_\epsilon^2}(\ln t), \quad (1)$$

где  $\mu_\epsilon$  и  $\sigma_\epsilon$  — параметры плотности нормального распределения  $\varphi_{\mu_\epsilon, \sigma_\epsilon^2}$ , в общем случае зависящие от величины нагрузки  $\epsilon$ . Выбор распределения (1) обусловлен тем, что в теории и практике надежности оно чаще других используется для описания статистики отказов полупроводниковых приборов и интегральных схем.

Будем решать следующую задачу. Пусть в результате проведения натурных ускоренных испытаний в форсированном режиме  $\epsilon$  (в условиях повышенной температуры, электрической нагрузки, влажности и т. д.) и моделирования процесса деградации изделий на ЭВМ получены две неоднородные относительно друг друга выборки объемом  $N_1$  и  $N_0$ . Положим также, что методом максимума правдоподобия найдены соответствующие точечные оценки логарифма среднего времени безотказной работы  $\hat{\mu}_\epsilon^{(N_1)}$  и  $\hat{\mu}_\epsilon^{(N_0)}$ , причем оценка  $\hat{\mu}_\epsilon^{(N_1)}$  найдена по группированным наблюдениям, так как в результате натурального эксперимента индивидуальные времена отказов неизвестны, а оценка  $\hat{\mu}_\epsilon^{(N_0)}$  — по рассчитанным на ЭВМ индивидуальным временам отказов.

Обозначим значения среднего времени безотказной работы, соответствующие первой и второй выборкам, через  $t_\epsilon^{(0_1)}$  и  $t_\epsilon^{(0)}$ . При этом будем считать, что  $t_\epsilon^{(0_1)}$  — истинное значение, а величина смещения  $l = t_\epsilon^{(0)} - t_\epsilon^{(0_1)}$  ограничена и лежит в пределах  $-c_1 \leq l \leq c_2$ , где  $c_1$  и  $c_2$  — заданные априори положительные числа. В этих условиях статистическим моделированием на ЭВМ требуется найти наилучшую в некотором смысле интервальную оценку среднего времени безотказной работы изделия в нормальных условиях его эксплуатации.

Для достижения поставленной цели воспользуемся асимптотическим подходом построения доверительных интервалов, согласно которому для асимптотически нормальной оценки  $\hat{\theta}$  некоторого параметра  $\theta$  границы доверительного интервала уровня  $1 - \gamma$  будут иметь вид [3]:  $\theta^- = \hat{\theta} \pm \frac{u_{\gamma/2} \sigma(\hat{\theta})}{\sqrt{N}}$ , где  $u_{\gamma/2}$  — квантиль нормального распределения порядка  $1 - \frac{\gamma}{2}$ ,  $\frac{\sigma(\hat{\theta})}{\sqrt{N}}$  — среднеквадратическое отклонение оценки  $\hat{\theta}$  так, что распределение  $\frac{(\hat{\theta} - \theta)\sqrt{N}}{\sigma(\hat{\theta})}$  слабо сходится к нормальному с параметрами  $(0, 1)$ , т. е.  $\frac{(\hat{\theta} - \theta)\sqrt{N}}{\sigma(\hat{\theta})} \Rightarrow \Phi_{0,1}$ .

Найдем предварительно асимптотическое распределение статистики  $\hat{t}_e^{(N_1)} = \exp\left(\mu_e^{(N_1)} + \frac{1}{2} \sigma_e^2\right)$ . Обозначив математическое ожидание оценки  $\hat{t}_e^{(N_1)}$  через  $\mu_e^{(0_1)}$ , т. е.  $\mu_e^{(0_1)} = M\hat{t}_e^{(N_1)}$ , и считая дисперсию  $\sigma_e^2$  известной и равной  $\sigma_e^2 = \sigma^2$ , получим

$$\hat{t}_e^{(N_1)} = \mu_e^{(0_1)} + \frac{\sigma}{\sqrt{N_1 \sum_{i=1}^k [\Phi(z_i) - \Phi(z_{i-1})]^2}} \eta = \mu_e^{(0_1)} + \frac{\sigma}{\sqrt{N_1 A}} N(0, 1).$$

Здесь  $\eta \sim N(0, 1)$  — нормально распределенная с параметрами  $(0, 1)$  случайная величина;  $\frac{\sigma}{\sqrt{N_1 A}}$  — среднеквадратическое отклонение логарифма времени до отказа изделий, наблюдения над которым осуществляются в моменты времени  $t_i$  и сгруппированы в  $k$  интервалов [4];  $\Phi(z_i) = \Phi(\ln t_i)$  — нормальная функция распределения.

Откуда следует, что  $\hat{t}_e^{(N_1)}$  будет распределена как  $\exp\left[\mu_e^{(0_1)} + \frac{\sigma^2}{2} + \frac{\sigma}{\sqrt{N_1 A}} N(0, 1)\right]$ , поэтому при  $N_1 \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} \hat{t}_e^{(N_1)} - t_e^{(0_1)} &= \exp\left[\mu_e^{(0_1)} + \frac{\sigma^2}{2} + \frac{\sigma}{\sqrt{N_1 A}} \eta\right] - \exp\left[\mu_e^{(0_1)} + \frac{\sigma^2}{2}\right] = \\ &= t_e^{(0_1)} \left[ \frac{\sigma}{\sqrt{N_1 A}} \eta + o\left(\frac{1}{N_1}\right) \right], \end{aligned}$$

где  $o\left(\frac{1}{N_1}\right)$  — случайная величина, характеризующая сходимость случайной последовательности по вероятности. Следовательно,

$$\sqrt{N_1} (\hat{t}_e^{(N_1)} - t_e^{(0_1)}) \sim t_e^{(0_1)} \left[ \frac{\sigma}{\sqrt{A}} \eta + o\left(\frac{1}{\sqrt{N_1}}\right) \right] \xrightarrow{P} N\left(0, \frac{[t_e^{(0_1)}]^2 \sigma^2}{A}\right).$$

Аналогично для статистики  $\hat{t}_e^{(N_0)} = \exp\left(\mu_e^{(N_0)} + \frac{1}{2} \sigma_e^2\right)$  при  $N_0 \rightarrow \infty$ :

$$\sqrt{N_0} (\hat{t}_e^{(N_0)} - t_e^{(0)}) \sim t_e^{(0)} \left[ \sigma \eta + o\left(\frac{1}{\sqrt{N_0}}\right) \right] \xrightarrow{P} N\left(0, [t_e^{(0)}]^2 \sigma^2\right).$$

Поставим следующий вопрос. Как выбрать границы доверительного интервала, чтобы в некотором смысле наилучшим образом учесть неоднородную информацию, содержащуюся как в выборке, полученной с помощью натуральных испытаний, так и в выборке, полученной статистическим моделированием на ЭВМ? Можно попытаться найти оптимальную величину границы в смысле минимума максимального по параметру  $t$

отклонения ее математического ожидания, используя неасимптотический подход, предложенный в [5].

Ввиду полной аналогии вычислительных процедур при нахождении нижней и верхней асимптотических доверительных границ рассмотрим случай только нижней границы, которую будем искать согласно основной идее указанной работы в виде

$$t_{\varepsilon}^{-} = a_0 + a_1 \widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_1)} + a_2 \widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_0)}, \quad (2)$$

где  $a_0$ ,  $a_1$  и  $a_2$  — некоторые положительные коэффициенты, причем  $a_1 + a_2 = 1$ .

Несмещенная оценка  $\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_1, N_0)}$  искомой величины  $t_{\varepsilon}^{(0)}$ , полученная объединением двух выборок объемом  $N_1$  и  $N_0$ , будет равна  $\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_1, N_0)} = a_1 \widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_1)} + a_2 (\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_0)} - l)$ ,  $-c_1 \leq l \leq c_2$ . Если обозначить

$$\delta = \widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_1, N_0)} - t_{\varepsilon}^{-} = -a_0 - a_2 l, \quad (3)$$

то  $t_{\varepsilon}^{-} = \widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_1, N_0)} - \delta$ . Тогда вероятность того, что  $t_{\varepsilon}^{-} \leq t_{\varepsilon}^{(0)}$ , будет равна  $P(t_{\varepsilon}^{-} \leq t_{\varepsilon}^{(0)}) = P(\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_1, N_0)} - \delta \leq t_{\varepsilon}^{(0)}) = P(\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_1, N_0)} \leq t_{\varepsilon}^{(0)} + \delta)$ . Так как  $\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_1, N_0)}$  распределена асимптотически нормально, при  $N_1$  и  $N_0 \rightarrow \infty$

$$P(\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_1, N_0)} \leq t_{\varepsilon}^{(0)} + \delta) = \Phi\left(\frac{\delta}{\sqrt{D}}\right), \quad (4)$$

где  $D$  — соответствующая дисперсия.

$$\text{Подставляя (3) в (4), получаем } \Phi\left(\frac{\delta}{\sqrt{D}}\right) = \Phi\left(\frac{-a_0 - a_2 l}{\sqrt{D}}\right).$$

При выбранном  $\gamma > 0$  определим далее такое  $a_0$ , чтобы выполнялось условие  $\min_l \Phi\left(\frac{-a_0 - a_2 l}{\sqrt{D}}\right) = 1 - \frac{\gamma}{2}$  при  $-c_1 \leq l \leq c_2$ . Очевидно, в этом случае коэффициент  $a_0$  будет

$$a_0 = -u_{\gamma/2} \sqrt{D} - a_2 c_2. \quad (5)$$

Из (3) и (4) следует, что  $\delta = u_{\gamma/2} \sqrt{D} + a_2 (c_2 - l)$ .

Согласно критерию сравнения оценок вида (2) [5], необходимо минимизировать по  $a_0$ ,  $a_1$  и  $a_2$  максимум по  $l$  функции  $M|t_{\varepsilon}^{(0)} - t_{\varepsilon}^{-}|$ , т. е. найти  $\min \max M|t_{\varepsilon}^{(0)} - t_{\varepsilon}^{-}|$ . Опуская промежуточные выкладки, по аналогии с  $a_0, a_1, a_2 - c_1 \leq l \leq c_2$  [5] можно показать, что выполнение этого условия приводит к следующему равенству (в силу большого  $N_0$  в качестве средних логнормального распределения  $t_{\varepsilon}^{(0)}$  и  $t_{\varepsilon}^{(0)}$  взяты их оценки  $\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_0)} - l$  и  $\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_0)}$ );

$$M|t_{\varepsilon}^{(0)} - t_{\varepsilon}^{-}| \approx \begin{cases} \frac{u_{\gamma/2} \sigma}{\sqrt{N_1 N_0 A}} \sqrt{(1 - a_2)^2 N_0 [\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_0)} - l]^2 + a_2^2 N_1 A [\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_0)}]^2 + a_2 (c_2 - l)} \\ \text{при } a_2 = \frac{N_0 [\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_0)} + c_1]^2 - v_1 v_2}{N_0 [\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_0)} + c_1]^2 + A N_1 [\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_0)}]^2}; \\ \frac{u_{\gamma/2} \sigma [\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_0)} - l]}{\sqrt{N_1 A}} \text{ при } a_2 = 0, \end{cases}$$

$$\text{где } v_1 = \frac{\sqrt{A N_1 N_0} (c_1 + c_2)}{u_{\gamma/2} \sigma} \text{ и } v_2 = \frac{A N_1 N_0 [\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_0)} + c_1]^2 [\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_0)}]^2}{N_0 [\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_0)} + c_1]^2 + A N_1 [\widehat{t}_{\varepsilon}^{(N_0)}]^2 - v_1^2}.$$

Покажем, что граница, определяемая формулой (2), является более предпочтительной в смысле меньшего значения  $M|t_{\varepsilon}^{(0)} - t_{\varepsilon}^{-}|$  по сравнению

с границей, определяемой только лишь по результатам статистического моделирования, для которой справедлива формула

$$\bar{t}_{\epsilon M} \approx \frac{1}{N_0} \sum_{j=1}^{N_0} t_j - u_{\gamma/2} \frac{\widehat{\sigma t}_{\epsilon}^{(N_0)}}{\sqrt{N_0}}. \quad (6)$$

Для этого сравним при различных значениях  $c_2$  и фиксированном  $c_1$  две величины  $M[t_{\epsilon}^{(0_1)} - \bar{t}_{\epsilon}]$  и  $M[t_{\epsilon}^{(0_1)} - \bar{t}_{\epsilon M}]$ .

Можно показать, что

$$\max_{c_1 < l < c_2} M[t_{\epsilon}^{(0_1)} - \bar{t}_{\epsilon}] = \begin{cases} \frac{u_{\gamma/2} \sigma v_2}{\sqrt{N_1 N_0 A}} + \frac{N_0 [\widehat{t}_{\epsilon}^{(N_0)} + c_1]^2 - v_1 v_2}{N_0 [\widehat{t}_{\epsilon}^{(N_0)} + c_1]^2 + A N_1 [\widehat{t}_{\epsilon}^{(N_0)}]^2} (c_1 + c_2), \\ \text{если } v_1^2 < N_0 [\widehat{t}_{\epsilon}^{(N_0)} + c_1]^2; \\ \frac{u_{\gamma/2} \sigma [\widehat{t}_{\epsilon}^{(N_0)} + c_1]}{\sqrt{N_1 A}}, \text{ если } v_1^2 \geq N_0 [\widehat{t}_{\epsilon}^{(N_0)} + c_1], \end{cases}$$

а для того же коэффициента доверия  $1 - \frac{\gamma}{2}$ :

$$\max_{-c_1 < l < c_2} M[t_{\epsilon}^{(0_1)} - \bar{t}_{\epsilon M}] = \max_{-c_1 < l < c_2} u_{\gamma/2} \frac{\widehat{\sigma t}_{\epsilon M}^{(N_0)}}{\sqrt{N_0}} + (c_2 - l) = u_{\gamma/2} \frac{\widehat{\sigma t}_{\epsilon M}^{(N_0)}}{\sqrt{N_0}} + (c_1 + c_2).$$

Простейший анализ показывает, что для небольших величин  $c_2$ , а именно, когда  $c_2 \leq c_0$ ,  $M[t_{\epsilon}^{(0_1)} - \bar{t}_{\epsilon}] \approx M[t_{\epsilon}^{(0_1)} - \bar{t}_{\epsilon M}]$ , и поэтому рассматриваемые оценки мало отличаются друг от друга в смысле принятого критерия сравнения. Значение  $c_2 = c_0$  определяется из условия  $v_1^2 = N_0 [\widehat{t}_{\epsilon}^{(N_0)} + c_1]^2$ . Однако когда  $c_2 > c_0$ , оценка вида (2) становится предпочтительнее оценки (6), так как  $M[t_{\epsilon}^{(0_1)} - \bar{t}_{\epsilon}] \leq M[t_{\epsilon}^{(0_1)} - \bar{t}_{\epsilon M}]$ . При этом границу (6) можно скорректировать. Это предлагается сделать с помощью умножения ее на поправочный коэффициент

$$K = \frac{M[t_{\epsilon}^{(0_1)} - \bar{t}_{\epsilon}]}{M[t_{\epsilon}^{(0_1)} - \bar{t}_{\epsilon M}]}$$

Таким образом, если зависимость  $l$  от величины нагрузки  $\epsilon$  известна (в частном случае  $l$  может не зависеть от  $\epsilon$ ), то, используя результаты статистического моделирования и введенный поправочный коэффициент, можно построить доверительную границу при нормальных условиях эксплуатации изделий. При независимости  $l$  от  $\epsilon$  она будет иметь вид

$$\bar{t}_{HM} = \left( \frac{1}{N_H} \sum_{m=1}^{N_H} t_m - u_{\gamma/2} \frac{\widehat{\sigma t}_H^{(N_H)}}{\sqrt{N_H}} \right) K,$$

где индекс  $H$  указывает на нормальные условия эксплуатации.

### Список литературы

1. Широков А. М., Борздов В. М., Молофеев В. М. // Тр. 39-й Всесоюз. науч. сессии, посвящ. Дню радио. М., 1984. Ч. 1. С. 60.
2. Широков А. М., Борздов В. М., Молофеев В. М. // Вестн АН БССР. Сер. физ.-техн. наук. 1985. № 2. С. 63.
3. Боровков А. А. Математическая статистика. М., 1984.
4. Кулдорф Г. Введение в теорию оценивания по группированным и частично группированным выборкам. М., 1966.
5. Лейфер А. А., Львова И. В. // Надежность и контроль качества. 1983. № 5. С. 55.